AES测薄膜厚度的误差分析与修正

盛国裕 杭州 中国计量学院机电工程教研室 310034

摘 要：本文介绍了AES测薄膜厚度的原理和方法,分析了测试过程中的各种误差,并探讨了各种误差的修正方法。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载到本机浏览。[下载全文]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 Acrobat Reader [下载阅读器]

The error analysis and correct of measuring film thickness with aes

310034

Abstract：The paper introduce the principle and method of measuring film thickness with AES. The various errors in measuring are analyzed. And the correcting methods of the various errors are discussed.

Key words：

【大 中 小】 [关闭窗口]